

適用規格									
定 格	使用温度範囲	-55 °C ~ +85 °C (注1)		保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C (注2)				
	電 圧	AC 100 V		保存湿度範囲	40% ~ 70% (注2)				
	電 流	0.5 A(信号部) (注3) 3.0A(MF端子部)		使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)				
性 能									
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT	AT			
構 造	外觀, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○	○			
	表示	目視にて確認する。			○	○			
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz)で測定する。		信号部 : 90 mΩ以下 MF端子部 : 30 mΩ以下	○	-			
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。		1000 MΩ以上	○	-			
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-			
機 械 的 性 能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。		差込力 60.0 N以下 引抜力 6.0 N以上	○	-			
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。		① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-			
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。		① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-			
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。			○	-			
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。		① 接触抵抗: 信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下	○	-			
	温度サイクル	温度 -55 → +85 °C 時間 30 → 30 分を 5 サイクル試験する。 (槽の移し変え時間は2~3分)		② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-			
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2 °C 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格: JIS C 60068)		はなはだしい腐食がないこと。	○	-			
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX260°C 220 °C以上 60秒以内		外觀の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	-			
		はんだごての場合: こて温度 360°C はんだ付け時間 5 秒以内			○	-			
はんだ付け性	はんだ温度 240±3 °C, 浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。		はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	-				
△の数						訂正記事	設計	検図	年月日
備考						承認	HS. OKAWA	11.09.29	
注1. 通電時の温度上昇を含みます。						検 図	KI. HIROKAWA	11.09.29	
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。						担 当	TH. SANO	11.09.29	
注3. 1端子当たりの定格電流となります。						製 図	TH. SANO	11.09.29	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目						図番		SLC4-159077-00	
HRS	製品規格表				製品名		FX18-100P-0.8SH		
	ヒロセ電機株式会社				製品コード		CL579-0005-3-00		
								△	1/1